## Трионы в структурах с квантовыми ямами с двумерным электронным газом

© Д.Б. Турчинович\*, В.П. Кочерешко\*, Д.Р. Яковлев\*,\*\*, В. Оссау\*\*, Г. Ландвер\*\*, Т. Войтович\*\*\*, Г. Карчевский\*\*\*, Я. Коссут\*\*\*

 \*Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия
\*\*Physikalisches Institut der Universität Würzburg, 97074 Würzburg. Deutchland

\*\*\* Institute of Physics Polish Academy of Sciences,

PL02608 Warsaw, Poland

Путем анализа спектров отражения от модулированно легированных структур с квантовыми ямами CdTe/CdMgTe исследовались связанные экситон-электронные комплексы — трионы и несвязанные экситонэлектронные состояния — комбинированный экситон-циклотронный резонанс. Установлено, что вклад трионов в диэлектрическую проницаемость сравним с экситонным вкладом. Проанализирована зависимость от магнитного поля параметров, описывающих вклад в диэлектрическую проницаемость для состояний экситон-циклотронного резонанса.

До недавнего времени процессы экситон-электронного взаимодействия считались достаточно изученными. Их рассмотрение сводилось к двум основным механизмам: 1) к разрушению свободными электронами экситонных состояний путем заполнения к-пространства и экранирования кулоновского электронно-дырочного взаимодействия в экситоне; 2) к увеличению экситонного затухания вследствие экситон-электронного рассеяния. Оба этих механизма ведут к разрушению экситонных состояний и подавлению экситонных линий в оптических спектрах. Недавно было обнаружено, что в условиях низкой концентрации свободных электронов в полупроводниковых квантовых ямах (КЯ) экситон-электронное взаимодействие приводит к образованию связанного экситонэлектронного комплекса (триона) [1,2]. Такие трионные состояния были обнаружены в полупроводниковых КЯ на основе соединений А2В6 и А3В5 [2,3]. В присутствии магнитного поля были обнаружены и несвязанные резонансные экситон-электронные состояния — экситон-циклотронный резонанс ЭЦР [4]. Настоящая работа посвящена исследованию спектров отражения от модулированно-легированных структур с КЯ CdTe/Cd<sub>0.7</sub>Mg<sub>0.3</sub>Te, содержащих двумерный электронный газ низкой плотности (ДЭГ).

Исследовались гетероструктуры CdTe/Cd<sub>0.7</sub>Mg<sub>0.3</sub>Te, выращенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках (100) GaAs. Структуры, состоящие из одиночной КЯ CdTe толщиной 80 Å, были модулированно  $\delta$ -легированы иодом на расстоянии 100 Å от КЯ. Концентрация электронов в КЯ составляла  $10^9 \text{ cm}^{-2}$  в нелегированной структуре и достигала  $10^{11} \text{ cm}^{-2}$  в легированной.

В отсутствие магнитного поля в спектрах отражения нелегированных структур с КЯ наблюдалась лишь одна линия, свободного экситона (X), тогда как в модулированно-легированных структурах наблюдаются две линии: X, соответствующая свободному экситону и соответствующая триону —  $X^-$  (рис. 1). Линия отражения триона смещена в длинноволновую сторо-

ну на ~3 meV относительно экситонной. Амплитуда линии  $X^-$  растет с увеличением электронной концентрации в КЯ, тогда как амплитуда экситона падает. В модулированно-легированной структуре экситонная линия существенно уширена за счет процессов экситонэлектронного рассеяния и экранирования свободными носителями. При высоком уровне легирования экситонная линия не наблюдается и в спектре отражения доминирует линия  $X^-$ . Это показывает, что основной вклад в диэлектрическую проницаемость легированных КЯ дает трионное состояние.

С ростом магнитного поля в спектрах отражения нелегированой структуры не наблюдалось никаких изменений. На рис. 1, а и b представлены спектры отражения модулированно-легированной структуры с КЯ в магнитных полях от 0 до 7.5 Т в двух циркулярных поляризациях  $\sigma^+$  и  $\sigma^-$ . В поляризации  $\sigma^+$  наблюдаются три линии отражения, соответствующие экситонному (X), трионному  $(X^{-})$  и экситон-циклотронному резонансам (ЭЦР). В этой поляризации амплитуда трионной линии отражения падает с ростом магнитного поля и при 4.5 Т линия Х<sup>-</sup> исчезает из спектра, тогда как амплитуда экситонной линии растет. В поляризации  $\sigma^-$  видны только линии X и  $X^-$ , амплитуды обоих резонансов несколько возрастают с магнитным полем. Максимум линии ЭЦР линейно смещается с ростом магнитного поля в сторону больших энергий с наклоном, близким к величине циклотронной энергии электрона. Аппроксимация этой линии к нулевому магнитному полю приводит к энергии экситонного резонанса. Происхождение этой линии экситон-циклотронного резонанса связывается со следующим процессом: падающий фотон рождает экситон с одновременным переходом дополнительного электрона между уровнями Ландау [4].

Все наблюдаемые переходы сильно поляризованы в магнитном поле. Поляризация линии отражения триона связана с тем, что основное состояние триона — синглет [1]. В достаточно сильном магнитном поле и при низкой температуре, когда все электроны собираются



**Рис. 1.** Спектры отражения от модулированно легированных структур с КЯ шириной 80 Å CdTe/Cd<sub>0.7</sub>Mg<sub>0.3</sub>Te, содержащих ДЭГ с концентрацией  $10^{11}$  cm<sup>-2</sup> в магнитном поле. a — в правой циркулярной поляризации света  $\sigma^+$ ; b — в левой циркулярной поляризации света  $\sigma^-$ .

на нижнем зеемановском подуровне, только экситоны с определенным угловым моментом могут образовывать связанное трионное состояние. А именно, в сильном магнитном поле, когда все электроны в ДЭГ ориентированы по направлению поля, может возбуждаться только экситон, в котором спин электрона антипараллелен внешнему полю. Поляризация линии отражения экситона противоположна поляризации триона [5]. Эта поляризация связана с различием экситонного затухания для  $\sigma^+$  и  $\sigma^-$  поляризаций. Одна из причин этого заключается в



**Рис. 2.** Зависимость положения линии экситона X, триона  $X^-$ , и экситон-циклотронного резонанса ExCR от магнитного поля полученное из обработки спектров рис. 1.

том, что в поляризации  $\sigma^-$  экситонное затухание может увеличиваться из-за существования канала быстрой релаксации для экситона при его связывании в трион. Вторая причина такой поляризации экситона может состоять в том, что из-за обменного вклада в экситон-электронное рассеяние в присутствии магнитного поля экситонное затухание становилось спин-зависимым. Необходимо отметить, что в нелегированных структурах экситонная линия отражения в магнитном поле не поляризована. Поляризация линии ЭЦР имеет тот же знак, что и поляризация экситона и прямо связана с ней.

На рис. 2 показаны зависимости положения линий отражения экситона, триона и ЭЦР от магнитного поля. Линии отражения экситона и триона обнаруживают квадратичный диамагнитный сдвиг с ростом магнитного поля. Линия ЭЦР сдвигается линейно с ростом поля в коротковолновую сторону на величину, близкую к циклотронной энергии электрона, с наклоном  $\propto 1.03$  meV/T.

Наблюдаемый спектр отражения описывается поляризуемостью КЯ  $\chi_{\alpha\beta}$  (детали теории, предложенной Р.А. Сурисом, см. в [6]) и с учетом ЭЦР имеет вид

$$\chi_{\alpha\beta} = \pi (d_{\alpha})^* d_{\beta} |\varphi(0)|^2 \frac{1}{\hbar \omega - E_{\text{ex}}(0) - i\Gamma^{\text{exc}}} + n_e \left| \int d^2 r \varphi(r) \right|^2 (d_{\alpha})^* d_{\beta} \int \frac{d^2 Q}{4\pi} \exp(-Q^2 L_H^2/2) \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left( \frac{Q^2 L_H^2}{2} \right) \frac{1}{\hbar \omega - E_{\text{ex}}(Q) - n\hbar \omega_{c,e} - i\Gamma^{\text{exc}}}, \quad (1)$$

где  $d_{\alpha(\beta)}$  — межзонный дипольный матричный элемент оптического перехода,  $\varphi(r)$  — огибающая функция экси-



**Рис. 3.** Зависимости эффективных параметров  $\Gamma_0^{\text{ExCR}}$  (1) и  $\Gamma_0^{\text{ExCR}}$  (2) для линии ExCR, полученные из обработки спектров рис. 1.

тона,  $E_{\rm ex}$  и  $\Gamma^{\rm exc}$  — энергия и затухание экситона, Q — экситонный волновой вектор в плоскости,  $L_H$  — магнитная длина,  $\hbar\omega_{c,e}$  — циклотронная энергия электрона,  $n_e$  — плотность двумерного электронного газа.

Первое слагаемое в (1) описывает вклад в поляризуемость от экситонных переходов. Второе, пропорциональное концентрации электронов, описывает вклад от резонансных состояний экситона и электрона — ЭЦР. Из (1) видно, что ширина линии отражения экситона определяется параметром затухания Г<sup>ехс</sup>. Член, описывающий ЭЦР, также содержит параметр Г<sup>ехс</sup> (второй член уравнения (1)). Это и может быть причиной поляризации линии отражения ЭЦР.

Из (1) видно, что экситонный вклад в спектр отражения описывается функцией Лоренцева типа. В то же время вклад ЭЦР (ExCR) описывается сверткой функций Лоренца и Гаусса. Можно показать, что этот интеграл — также функция Лоренцева типа с эффективными параметрами: радиационным затуханием  $\Gamma_0^{\text{ExCR}}$ , нерадиационным затуханием  $\Gamma_0^{\text{ExCR}}$  и резонансной частотой  $\hbar \omega_0^{\text{ExCR}} = \hbar \omega_{c,e} \left(1 + \frac{m_e}{m_e + m_{hh}}\right)$ , где  $m_e$  и  $m_{hh}$  — эффективные массы электрона и дырки, соответственно.

Для определения этих параметров мы использовали метод подгонки спектров отражения, применив подход, описывающий экситонное отражение в КЯ [7].

Ширина линии отражения ЭЦР определяется эффективным затуханием  $\Gamma^{\text{ExCR}}$ , которое оказывается пропорциональным магнитному полю (1). При достаточно большом магнитном поле, когда  $\Gamma^{\text{ExCR}}$  превосходит неоднородную ширину линии ЭЦР, ее ширина линейно растет с магнитным полем (рис. 3). Заметим, что ширина экситонной линии отражения падает в магнитном поле. На рис. З также показана зависимость амплитуды линии ЭЦР от магнитного поля, которая определяется эффективным радиационным затуханием  $\hbar\Gamma_0^{ExCr}$ . Она уменьшается с ростом магнитного поля. Отношение интенсивности первого пика комбинированного экситонциклотронного резонанса к интенсивности экситонного резонанса  $S_0$  будет

$$\frac{S^{\text{ExCR}}}{S_0} = 8n_e L_H^2. \tag{2}$$

Таким образом, амплитуда линии ЭЦР должна линейно уменьшаться с магнитным полем, что согласуется с экспериментом (рис. 3). Такое уменьшение амплитуды линии отражения ЭЦР контрастирует с обычно наблюдаемым поведением экситонных линий, амплитуда которых растет с магнитным полем.

Таким образом, в работе исследовались спектры отражения в магнитном поле от модулированно легированных структур с квантовыми ямами, содержащих двумерный электронный газ. В спектрах отражения этих структур наблюдались переходы, связанные с возбуждением экситонов, трионов и экситон-циклотронного резонанса. Обнаружено, что вклад в диэлектрическую проницаемость оптических переходов, связанных с фотовозбуждением трионов и ЭЦР, сравним со вкладом от экситонных переходов. Путем анализа контура отражения ЭЦР установлена зависимость параметров, описывающих вклад этих процессов в спектр отражения от магнитного поля.

Работа получила частичную финансовую поддержку от РФФИ (грант № 95-02-0406), INTAS (N 93-3657 Ext), Volkswagen Foundation и программы "Наноструктуры" Миннауки России.

## Список литературы

- K. Kheng, R.T. Cox, Y. Merle d'Aubigne, F. Bassani, K. Saminadayr, S. Tatarenko. Phys. Rev. Lett. 71, 1752 (1993).
- [2] G. Finkelstein, H. Shtrikman, I. Bar-Joseph. Phys. Rev. Lett. 74, 976 (1995); A.J. Shields, M. Pepper, D.A. Ritchie, M.Y. Simmons, G.A.C. Jones. Phys. Rev. B51, 18049 (1995).
- [3] G. Finkelstein, H. Shtrikman, I. Bar-Joseph. Phys. Rev. B53, R 1709 (1996).
- [4] D.R. Yakovlev, V.P. Kochereshko, R.A. Suris, W. Ossau, A. Waag, G. Landwehr, P.C.M. Christianen, J.C. Maan. Proc. 23d Int. Conf. Physics of Semiconductors (Berlin, 1996). World Scientific, Singapore (1996). P. 2071.
- [5] V.P. Kochereshko, D.R. Yakovlev, A.V. Platonov, W. Ossau, A. Waag, G. Landwehr, R. Cox. Proc. 23d Int. Conf. Physics of Semiconductors (Berlin, 1996). World Scientific, Singapore (1996). P. 1943.
- [6] V.P. Kochereshko, D.R. Yakovlev, R.A. Suris, W. Ossau, A. Waag, G. Landwehr, P.C.M. Christianen, J.C. Maan. Superlattices and Microstructures, in press; D.R. Yakovlev, V.P. Kochereshko, R.A. Suris, H. Schenk, W. Ossau, A. Waag, G. Landwehr, P.C.M. Christianen, J.C. Maan. Phys. Rev. Lett., in press.
- [7] E.L. Ivchenko, A.V. Kavokin, V.P. Kochereshko, G.R. Pozina, I.N. Uraltsev, D.R. Yakovlev, R.N. Bicknell-Tassius, A. Waag, G. Landwehr. Phys. Rev. B46, 7713 (1992).